平成31年度 大阪大学基礎工学部編入学試験 [エレクトロニクスコース専門科目] 試験問題

受	験	番	号	志望学科・コース
				学 科

[エレ専門-1]

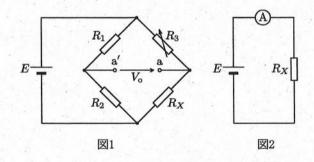
PB 是直 1 電気回路に関する以下の問に答えよ、

- (1) 抵抗 R_i (i=1,2,3,X) で構成されたブリッジ回路に、直流電源 E を接続した図 1 の回路について考える.
 - (1-1) 図1中に定義されている端子対 a-a' 間の電圧 V。を求めよ.
 - (1-2) $V_0=0$ となるために R_i (i=1,2,3,X) が満たすべき条件を求めよ. ただし、E>0 とする.
 - (1-3) はじめに R_3 を調整して回路が (1-2) の状態になったとする.その後, R_X が $R_X+\Delta R_X$ (ただし, $|\Delta R_X/R_X|\ll 1$) に変化したときの V_0 を $\Delta R_X/R_X$ の 1 次までの近似式として求めよ.解答欄には計算の過程も記述すること.また,必要なら,

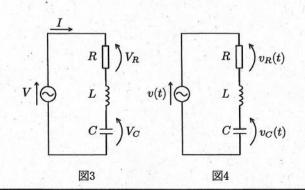
$$\frac{1+x}{c+1+x} \simeq \frac{1}{c+1} + \frac{c}{(c+1)^2}x \qquad (|x| \ll 1)$$

の関係を使って良い.

- (1-4) (1-3) の方法で $\Delta R_X/R_X$ を測定する際に、その感度を最大にするための条件を R_i (i=1,2,3) の中から必要なものを用いて答えよ.
- (1-5) このようなブリッジ回路を用いた $\Delta R_X/R_X$ の測定法が,図 2 に示す回路を用いるよりも優れている点を述べよ.



- (2) 抵抗 R, インダクタ L, キャパシタ C を直列に接続し、角周波数 ω の交流電源 V (複素数表示) を接続した図 3 の回路について考える. なお、虚数単位を j とする.
 - (2-1) この回路に流れる電流 I (複素数表示)を求めよ.
 - (2-2) |I| を最大にする角周波数 ω_r を求めよ.
 - (2-3) |I| と $\angle I$ $\angle V$ の ω 依存性の概略を,解答用紙に示されたグラフの中に図示せよ.ただし, $\angle X$ は複素数 X の偏角である.
 - (2-4) $\omega=\omega_{\mathrm{r}}$ のときの、 V_R (複素数表示) と V_C (複素数表示) を求めよ.
 - (2-5) この回路の電源電圧が $v(t)=V_{\rm m}\cos\omega_{\rm r}t$ (t は時間, $V_{\rm m}$ は正の実数) のとき,図 4 中に定義される電圧 $v_R(t)$ と $v_C(t)$ の 概略を,解答用紙に示されたグラフの中に, $\omega_{\rm r}t$ の関数として図示せよ.



平成31年度 大阪大学基礎工学部編入学試験 [エレクトロニクスコース専門科目] 試験問題

受	験	番	号	志	望	学 科	= - 7	ζ_
		-				Seve.	学	科
							٦-	-ス

[エレ専門-2]

問題 2 半導体に関する以下の間に答えよ.

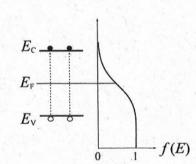
- (1) GaAs(ガリウム砒素)は、価電子帯の上端と伝導帯の下端の波数が一致している ア 型半導体であることから、 価電子帯と伝導帯の間で高効率なキャリアの遷移が生じ易い、従って、 イ などの光デバイスに応用されて いる. ア と イ に入る適切な語句を示せ.
- (2) Si のような IV 族真性半導体に不純物を添加(ドーピング)して n 形半導体とした. このとき、添加された不純物は一般的に ウ と呼ばれ、例として エ のような元素が挙げられる. ウ と エ に入る適切な語句や元素記号を示せ.
- (3) 電界による半導体中の電子の移動について考える.

結晶中の電子(素電荷 q)が電界 E によって受ける力FはF=- オーであり、これにより加速されるときの加速 $E(\frac{dv}{dt})$ は、運動方程式 $F=m_e^*\frac{dv}{dt}$ $(m_e^*$ は電子の有効質量)から、 $\frac{dv}{dt}=-$ カーとなる。

一方,電子が衝突せずに移動する時間を τ とし,衝突のたびごとに速度を失うとすれば,単位時間当たりに失う速度は $\frac{dv}{dt} = -\left(\frac{1}{\tau}\right)v$ となるので,これを考慮した電子の加速度の式は, $\frac{dv}{dt} = -\left[\frac{1}{\tau}\right)v$ となる.定常状態では $\frac{dv}{dt} = 0$ であるから,最終的に $v = -\left[\frac{1}{\tau}\right)E$ となる.ここで, $\left[\frac{1}{\tau}\right]$ は電子の移動度と呼ばれ,半導体における最も重要な因子の一つである.

オー~ キーに入る適切な式を示せ.

(4) 右図は、室温付近で、真性半導体の価電子帯から電子が励起され、電子・正孔が共に若干生成している様子を示している。ここで、 $E_{\rm C}$, $E_{\rm F}$, $E_{\rm V}$ は それぞれ、伝導帯の下端、フェルミ準位、価電子帯の上端であり、 f(E) はフェルミ・ディラック分布関数である。この図を参考にして、解答用紙の図中に ${\bf n}$ 形半導体の伝導帯の電子生成の様子とフェルミ・ディラック分布関数を図示せよ。ただし、フェルミ準位の位置を明示すること。



(5) 下図は、n形半導体と金属の電気抵抗率の温度依存性を測定したグラフの一例である.n形半導体で、温度の上昇とともに電気抵抗率が減少する理由を説明せよ.

